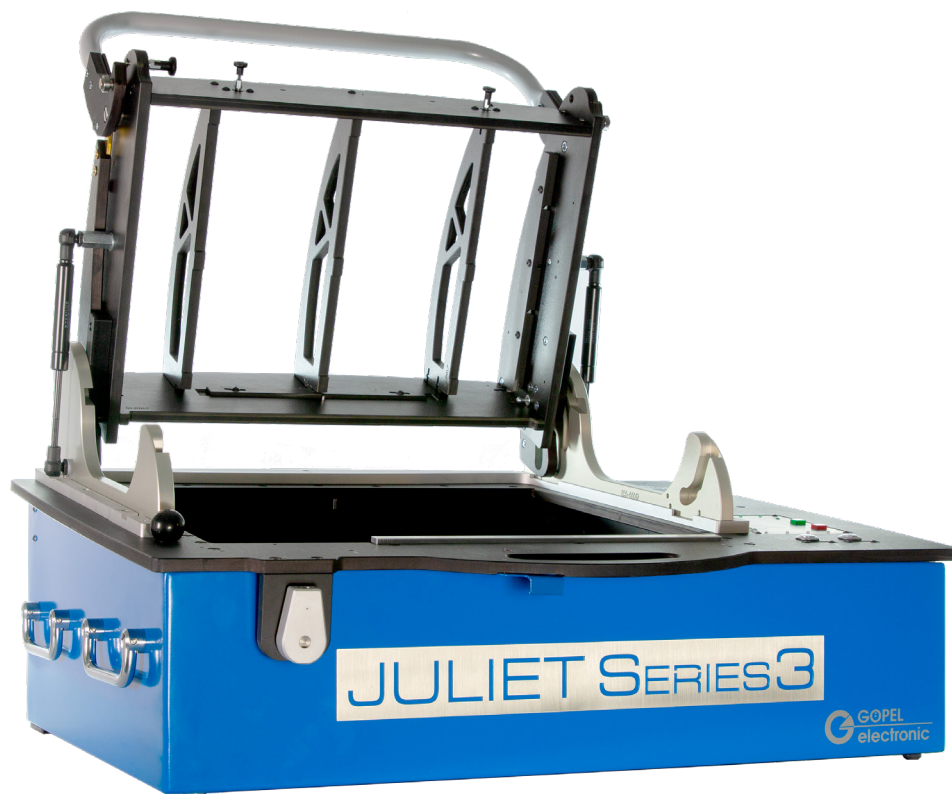


# JULIET Series 3

Dynamische Mixed-Signal-Tests und ISP für Prototyping und Produktion

- Auffinden von Kurzschlüssen und Unterbrechungen
- Überprüfung von externen Schnittstellen
- Programmieren der Baugruppe
- funktionaler Test der Anwendung
- Baugruppenkalibrierung



# Technische Spezifikationen

## Funktionale Tests

- Entladung und Power up
- Treiben & Messen analoger Spannungen
- Treiben & Messen digitaler Sequenzen
- Waveformgenerator und Frequenzmessung
- funktioneller Zugriff auf Mikroprozessoren

## Software

- Tester Link Software (TLS)
- online PASS/FAIL-Statistik
- SYSTEM CASCON™
- optionale MES-Anbindung

## PCB-Anforderungen

- max. Baugruppenmaße: 340 mm x 230 mm
- beidseitige Kontaktierung bis min. 50 mil
- max. Anzahl der Nadeln: 600 (1 N)

## Testerschnittstelle

- 4 Spannungsversorgungen (intern/extern)
- 4 Test Access Ports (TAPs) mit bis zu 100 MHz
- 192 hybride Testkanäle (digital/analog)
- 32 Multi-Purpose Ports (MPP)
- 16 differentielle Kanäle
- 8/8 galvanisch getrennte I/O-Kanäle
- 32 analoge Messkanäle
- 16 analoge Ausgangskanäle
- 8 RS232-Schnittstellen
- 4 RS485-Schnittstellen

## Mechanik

- kompaktes, transportables Auf Tischgerät
- Industriemechanik manueller Be- und Entladung
- Wechselkassetten für Nadelbettadapter
- Bedienung über Tastenpanel während der Produktion
- LED-Anzeige aller Testergebnisse
- Front-Interface für die komfortable Messung von Signalen

## Embedded JTAG

- IEEE 1149.1 - Boundary Scan
- IEEE 1149.6 - differential Boundary Scan
- IEEE 1149.8.1 - selective toggle
- Interconnection/RAM/Cluster-Test
- JTAG, SWD, BDM, SBW, PIC1x
- VarioTAP®, ChipVORX®, VarioCore

## Flash-Programmierung

- MCU-interner Flash
- externer Flash (NAND, NOR)
- Bad Block Handling
- PLD/CPLD
- Seriennummern
- Produktionsdaten
- Kalibrierdaten

## Geräteparameter

- elektrischer Anschluss: 100-240 VAC, 50-60 Hz, max. 350 W
- Abmaße: 630 mm (B) x 550 mm (T) x 345 mm (H)
- Gewicht: ca. 30 kg
- Umgebungstemperatur: 10-35 °C

